



CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,  
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,  
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,  
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,  
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,  
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類 :

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

---

channels 232 that guide the one sample liquid from the sample liquid supply inlet 231 to the plurality of sensor parts 22.

(57) 要約 : 1回のサンプリングで複数項目の測定を行える電気化学分析チップを提供する。電気化学分析チップ2は、複数の電極242, 243, 244を有するとともに絶縁性の基材21に設けられたセンサ部22と、基材21に設けられて試料液をセンサ部22に導く流路部23とを備えている。基材21に複数のセンサ部22が設けられている。流路部23は、基材21の外面に開口した試料液供給口231と、同一の試料液を試料液供給口231から複数のセンサ部22に導く試料液流路232とを備えている。

## 明 細 書

**発明の名称**：電気化学分析チップ

### 技術分野

[0001] 本発明は、試料液中に含まれ得る特定物質の濃度を測定するための電気化学分析チップに関する。

### 背景技術

[0002] 電気化学測定の原理を利用した測定は、溶液中の重金属の高感度測定や、酵素電極を利用したグルコース測定、イオン電極を利用したpH（ペーハー）の測定、残留農薬の電気化学検出に代表される食物検査など、多くの場面で使用されている（例えば特許文献1参照）。

[0003] 電気化学測定において、絶縁性の基板の上に電極を形成した電気化学分析チップを使用できることが知られている。電気化学分析チップにおいて、電極は基本的に単層構造であり、電極材料としては、銀、白金、金、アルミニウムなどの金属材料、又は炭素などの導電性材料が用いられる。

[0004] ところで、従来の電気化学分析チップを用いて多項目の測定を同時に行う場合には、それぞれにサンプリング操作が必要であった。しかし、それぞれにサンプリング操作を行なうと、濃度斑（サンプル検体の位置や、サンプリング箇所、初期のものなのか、中間なのか等で濃度が異なる）が生じ、測定精度や再現性が低下するという問題があった。また、同一の試料液に対して複数回のサンプリング操作を行うには、多量の試料液が必要になるという問題があった。

### 先行技術文献

#### 特許文献

[0005] 特許文献1：特開平11-248668号公報

### 発明の概要

#### 発明が解決しようとする課題

[0006] 本発明は、上記現状を改善すべく成されたものであり、1回のサンプリン

グ操作で複数項目の測定を行える電気化学分析チップを提供することを目的とする。

### 課題を解決するための手段

- [0007] 本発明の電気化学分析チップは、複数の電極を有するとともに絶縁性の基材に設けられたセンサ部と、前記基材に設けられて試料液を前記センサ部に導く流路部とを備えたものであって、前記基材に複数の前記センサ部が設けられており、前記流路部は、前記基材の外面に開口した試料液供給口と、同一の試料液を前記試料液供給口から複数の前記センサ部に導く試料液流路とを備えているものである。
- [0008] 本発明の電気化学分析チップによれば、試料液流路によって同一の試料液を試料液供給口から複数のセンサ部に導くことができるので、1回のサンプリング操作で複数のセンサ部に同一の試料液を接触させることができる。これにより、微量の試料液であっても1回のサンプリング操作で複数項目の測定を行えるようになる。
- [0009] 本発明の電気化学分析チップにおいて、前記流路部は、1つの前記試料液供給口に繋がる複数の前記試料液流路を備えているようにしてもよい。
- [0010] このような態様によれば、1つの試料液供給口に試料液を接触させるだけで、複数のセンサ部に試料液を導入できるので、サンプリング操作が容易であるとともに、サンプリング操作に要する時間を短時間化できる。
- [0011] 本発明の電気化学分析チップにおいて、前記流路部は、複数の前記センサ部ごとに前記試料液供給口と前記試料液流路とを備えており、複数の前記試料液供給口は、前記基材の外面に互いに近接配置されているようにしてもよい。
- [0012] このような態様によれば、センサ部ごとに試料液供給口と試料液流路とを設けることで、各センサ部に試料液を確実に導入できる。また、センサ部ごとに設けられた試料液供給口が基材の外面に互いに近接配置されていることで、それらの試料液供給口に1回のサンプリング操作で試料液を確実に接触させることができ、サンプリング処理の確実性を向上できる。

- [0013] 本発明の電気化学分析チップにおいて、前記センサ部は、前記基材に装着可能な電極チップに設けられており、前記基材は、前記基材の外面に開口して前記電極チップが挿入される電極チップ配置部を備えており、前記電極チップ配置部に前記試料液流路が繋がっているととも、前記電極チップ配置部の内壁と前記電極チップとの間に、試料液が毛細管現象によって前記試料液流路から前記電極チップ配置部の開口に向けて浸透する隙間が設けられているようにしてもよい。
- [0014] このような態様によれば、測定項目に応じて電極チップを交換することで、多数の測定項目に対応可能とできるので、汎用性が向上する。
- [0015] 本発明の電気化学分析チップにおいて、前記基材は、前記センサ部が形成されたベース基板と、前記流路部を形成する流路基板と、前記流路基板を覆うカバー基板とが積層されて構成されているようにしてもよい。
- [0016] このような態様によれば、センサ部をベース基板に一体化することで、電気化学分析チップの小型化が可能になる。
- [0017] 本発明の電気化学分析チップにおいて、前記センサ部は、前記電極として、作用電極と参照電極とを備えており、又は作用電極と参照電極と対極を備えており、前記電極は、絶縁性の基板の上に形成された金属層と、前記基板上に前記金属層を覆って形成された炭素層と、前記金属層の上面と前記炭素層との間に形成された上部接着層と、を備え、前記上部接着層はシリコンで形成されているようにしてもよい。
- [0018] このような態様によれば、各電極は金属層を有しているので、電気抵抗を低くして、測定感度を向上できる。また、金属層を炭素層で覆うことで、金属層の酸化還元を防止でき、測定感度及び再現性を向上できる。さらに、金属層の上面と炭素層との間にシリコンで形成された上部接着層を設けることで、金属層と炭素層との密着性を向上させるとともに、シリコンは金属に比べて電気抵抗率が高いので、測定中における金属層上面での水素の発生を抑制し、金属層と炭素層との剥離を防止して、測定感度及び再現性を向上できる。

## 発明の効果

[0019] 本発明は、1回のサンプリングで複数項目の測定を行える電気化学分析チップを提供できる。

## 図面の簡単な説明

- [0020] [図1]電気化学測定装置の一例を示す概略構成図である。  
[図2]電気化学分析チップの一実施形態を示す平面図である。  
[図3]同電気化学分析チップの分離斜視図である。  
[図4]同電気化学分析チップの側面視中央縦断面図である。  
[図5]電極チップを示す概略的な平面図である。  
[図6]図5のA-A位置に対応する概略的な断面図である。  
[図7]実施形態に取り付ける電極チップと比較チップとを使用して得られた電流電位曲線を示すグラフである。  
[図8]測定後の電極チップ及び比較チップの作用電極を基板側から撮像した顕微鏡写真であり、(A)は実施形態(電極チップ)を示し、(B)は比較例(比較チップ)を示す。  
[図9]電極チップの他の構成を示す概略的な断面図である。  
[図10]電気化学分析チップの他の実施形態を示す平面図である。  
[図11]電気化学分析チップのさらに他の実施形態を示す平面図である。  
[図12]同電気化学分析チップの分離斜視図である。

## 発明を実施するための形態

- [0021] 電気化学分析チップの実施形態について図面に基づいて説明する。図1は、電気化学測定装置の一例を示す概略構成図である。図2は、電気化学分析チップの一実施形態を示す平面図である。図3は、同電気化学分析チップの分離斜視図である。図4は、同電気化学分析チップの側面視中央縦断面図である。なお、図2では、カバー基板213の図示は省略している。また、図4では、便宜上、各部材の厚みを大きくして図示している。
- [0022] 図1に示すように、電気化学測定装置1は、電気化学分析チップ2と、電気化学分析チップ2に接続されるポテンショスタット3と、ポテンショスタ

ット3に接続される操作部4、表示部5、電源部6及び外部出力部7を備えている。本実施形態では、電気化学分析チップ2は使い捨て型のものである。

[0023] 図2～図4に示すように、電気化学分析チップ2は、絶縁性の基材21と、基材21に設けられた複数のセンサ部22と、基材21に設けられて試料液を各センサ部22に導く流路部23とを備えている。本実施形態では、3つのセンサ部22が設けられているが、本発明の電気化学分析チップにおいて、センサ部の数は、2つ又は4つ以上であってもよい。

[0024] 基材21は、ベース基板211の上に、流路基板212を介してカバー基板213が配置されて構成されている。ベース基板211、流路基板212及びカバー基板213は、略四角形の絶縁性基板で構成されている。

[0025] 流路基板212には、センサ部22を有する電極チップ24を差込み可能な切欠き部214と、流路部23を構成する試料液供給口231及び試料液流路232を形成するための溝215が形成されている。本実施形態では、3つの切欠き部214が形成されている。

[0026] 切欠き部214は、流路基板212の第1側面212aに開口しており、電極チップ24の幅寸法よりもわずかに大きい幅寸法で形成されている。切欠き部214がベース基板211とカバー基板213とで覆われることで、電極チップ配置部216が形成されている。

[0027] 溝215は、流路基板212の一表面に形成されており、流路基板212の第1側面212aに対向する第2側面212bから第1側面212aへ向かって延び、中途部で3本に分岐されて、3つの切欠き部214に繋がっている。溝215がカバー基板213で覆われることで、基材21の外面（流路基板212の第2側面212b）に開口した試料液供給口231と、同一の試料液を試料液供給口231から複数のセンサ部22に導く試料液流路232とを有する流路部23が形成されている。

[0028] ベース基板211、流路基板212及びカバー基板213を構成する絶縁性基板の材質は特に限定されず、例えば、ガラス、石英ガラス、ポリイミド

(P I)、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリカーボネート (PC)、ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、ポリスチレン (PS)、ポリ塩化ビニル (PVC)、ポリオキシメチレン (POM)、ABS樹脂 (ABS)、メタクリル樹脂 (PMMA)などを挙げることができる。また、絶縁性基板の形状、厚み及び大きさは、特に限定されない。

[0029] また、試料液供給口231及び試料液流路232の寸法は、試料液を毛細管現象によって試料液供給口231から試料液流路232に導入してセンサ部22に導くことができる寸法であればよい。また、試料液流路232の内壁面(溝215の内壁面及びカバー基板213の流路基板212との接合面)に、濡れ性を向上させる親水性処理層を形成するようにしてもよい。

[0030] 図3及び図4に示すように、電気化学分析チップ2の基材21は、ベース基板211、流路基板212及びカバー基板213をこの順序で積層し、一体化することで形成される。ベース基板211と流路基板212との接合、及び、流路基板212とカバー基板213との接合には、例えば接着剤や熱融着を使用できる。

[0031] 基材21の電極チップ配置部216には、センサ部22を有する電極チップ24が取り付けられる。電極チップ24は平板状の絶縁性の基板241を備え、基板241上に作用電極242、対極243及び参照電極244が互いに絶縁されて設けられている。基板241は平面視で略長方形の形態を有している。作用電極242、対極243及び参照電極244は、基板241の長手方向の一端近傍から他端近傍にわたって設けられている。作用電極242、対極243及び参照電極244の長手方向中途部は、基板241上に形成された絶縁層245で覆われている。作用電極242、対極243及び参照電極244の一端側はセンサ部22を構成している。

[0032] 電極チップ24の一端側が基材21の電極チップ配置部216に差し込まれることで、センサ部22(作用電極242、対極243及び参照電極244の一端側)が、電極チップ配置部216の内部に配置される。電極チップ配置部216の内壁と電極チップ24の間には、毛細管現象によって流路

部 2 3 に導入された試料液が、毛細管現象によって電極チップ配置部 2 1 6 の開口側（第 1 側面 2 1 2 a 側）へ浸透する程度の小さな隙間が形成されている。

[0033] なお、電極チップ配置部 2 1 6 の内壁と電極チップ 2 4 との間の隙間の大きさは、試料液が毛細管現象によって試料液流路 2 3 2 から電極チップ配置部 2 1 6 の開口に向けて浸透する程度の大きさであれば、特に限定されない。また、電極チップ配置部 2 1 6 の内壁面（切欠き部 2 1 4 の内壁面、ベース基板 2 1 1 の流路基板 2 1 2 との接合面、及びカバー基板 2 1 3 の流路基板 2 1 2 との接合面）に濡れ性を向上させる親水性処理層を形成するようにしてもよい。

[0034] 電極チップ 2 4 の他端側に位置する作用電極 2 4 2、対極 2 4 3 及び参照電極 2 4 4 の他端側は、基材 2 1 の外部に配置され、コネクタ 8 及びケーブル 9（図 2 参照）を介してポテンショスタット 3（図 1 参照）に電氣的に接続される。電極チップ 2 4 は、コネクタ 8 に着脱可能に取り付けられる。

[0035] 電気化学分析チップ 2 の試料液供給口 2 3 1 に試料液が供給されると、試料液は、毛細管現象によって、試料液流路 2 3 2 内を 3 つの電極チップ配置部 2 1 6（切欠き部 2 1 4）のそれぞれに向かって流れ、各電極チップ配置部 2 1 6 に導入される。電極チップ配置部 2 1 6 に導入された試料液は、毛細管現象によって、電極チップ配置部 2 1 6 と電極チップ 2 4 との間の隙間を電極チップ配置部 2 1 6 の開口側（第 1 側面 2 1 2 a 側）へ向かって流れ、電極チップ 2 4 のセンサ部 2 2 に接触する。

[0036] 図 1～図 4 に示すように、本実施形態の電気化学分析チップ 2 は、複数の電極 2 4 2、2 4 3、2 4 4 を有するとともに絶縁性の基材 2 1 に設けられたセンサ部 2 2 と、基材 2 1 に設けられて試料液をセンサ部 2 2 に導く流路部 2 3 とを備えている。基材 2 1 に複数のセンサ部 2 2 が設けられており、流路部 2 3 は、基材 2 1 の外面に開口した試料液供給口 2 3 1 と、同一の試料液を試料液供給口 2 3 1 から複数のセンサ部 2 2 に導く試料液流路 2 3 2 とを備えている。

- [0037] 電気化学分析チップ2によれば、試料液流路232によって同一の試料液を試料液供給口231から複数のセンサ部22に導くことができるので、1回のサンプリング操作で複数のセンサ部22に同一の試料液を接触させることができる。これにより、微量の試料液であっても1回のサンプリング操作で複数項目の測定を行えるようになる。
- [0038] 電気化学分析チップ2において、流路部23は、1つの試料液供給口231に繋がる複数の試料液流路232を備えている。これにより、1つの試料液供給口231に試料液を接触させるだけで、複数のセンサ部22に試料液を導入できるので、サンプリング操作が容易であるとともに、サンプリング操作に要する時間を短時間化できる。
- [0039] 電気化学分析チップ2において、センサ部22は、基材21に装着可能な電極チップ24に設けられている。基材21は、基材21の外面に開口して電極チップ24が挿入される電極チップ配置部216を備えている。電極チップ配置部216に試料液流路232が繋がっていると同時に、電極チップ配置部216の内壁と電極チップ24との間に、試料液が毛細管現象によって試料液流路232から電極チップ配置部216の開口に向けて浸透する隙間が設けられている。これにより、測定項目に応じて電極チップ24を交換することで、多数の測定項目に対応可能とできるので、電気化学分析チップ2の汎用性が向上する。
- [0040] 次に、図5及び図6も参照しながら、センサ部22を有する電極チップ24の電極について説明する。電極チップ24の基板241の少なくとも一表面は、平坦な絶縁性材料で形成されている。基板241としては、例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリイミドフィルム、ガラス基板、エポキシガラス（ガラエポ）基板などである。ただし、基板241の材料は、これらに限定されず、セラミックスや石英ガラスなどであってもよい。
- [0041] 電極チップ24において、作用電極242、対極243及び参照電極244のそれぞれは、基板241の上に形成された金属層251と、基板241上に金属層251を覆って形成された炭素層252と、基板241と金属層

251との間に形成された下部接着層253と、金属層251の上面と炭素層252との間に形成された上部接着層254とを備えている。参照電極244の一端側の炭素層252上面に、銀塩化銀層255が形成されている。

[0042] 下部接着層253は、基板241と金属層251との剥離を防止する薄膜であり、例えばシリコンで形成されている。下部接着層253の材料としては、基板241及び金属層251との密着性が良好なものであればよく、シリコンの他、例えば、クロム、チタン（炭素と共有結合する金属）などを使用できる。

[0043] 金属層251は、炭素層252よりも電気抵抗率が低い材料で形成されており、下部接着層253の上に形成されている。金属層251は、作用電極242、対極243及び参照電極244のそれぞれの一端と他端との間の電気抵抗を下げるためのものである。金属層251の材料としては、例えば、銀、ルテニウム、タンタル、チタン、銅、アルミニウム、白金、ニオブ、ジルコニウム、若しくはこれらの元素の合金、又はこれらの元素と炭素との合金などを使用できる。

[0044] 上部接着層254は、金属層251の上面に形成されており、金属層251の上面と炭素層252との剥離を防止する薄膜であり、シリコンで形成されている。

[0045] 炭素層252は、下部接着層253、金属層251及び上部接着層254を覆うようにして基板241上に形成されている。炭素層252は、例えばアモルファスカーボン、又はダイヤモンドライクカーボン（DLC）で形成されている。また、炭素層252は、平面視で下部接着層253、金属層251及び上部接着層254の輪郭を囲うように形成されており、炭素層252の下面周縁部は基板241に接触している。下部接着層253、金属層251及び上部接着層254は、基板241と炭素層252とで囲われることで、周囲雰囲気から隔離されている。

[0046] 炭素は、次のような特性を有するので、金属層251を保護する炭素層252の使用に適している。（1）3000℃の真空中（500℃の空气中）

でも優れた安定性をもつ、(2) 化学薬品に侵されにくい、(3) ガスや溶液を透過しない、(4) 優れた硬度、強度をもつ、(5) 優れた電気伝導性をもつ、(6) 金属塩などの湿潤に抵抗がある、(7) 血液や組織適合性が良好である、(8) 物理特性、化学特性の等方性がある。

[0047] 下部接着層 253、金属層 251、上部接着層 254 及び炭素層 252 の製造方法としては、各層の形状及び膜厚を高精度に制御できることから、蒸着法であることが好ましい。ここで、蒸着法としては、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの、いわゆる物理気相成長法 (PVD) や、いわゆる化学的気相成長法 (CVD) を使用できる。ただし、各層の製造方法は、蒸着法に限定されず、スクリーン印刷法やインクジェット印刷法などの印刷法であってもよい。

[0048] 本実施形態において、電極 242, 243, 244 は、絶縁性の基板 241 の上に形成された金属層 251 と、基板 241 上に金属層 251 を覆って形成された炭素層 252 と、基板 241 と金属層 251 との間に形成された下部接着層 253 と、を備えている。電極 242, 243, 244 は、金属層 251 を有することで電気抵抗を低くして、測定感度を向上できる。また、金属層 251 を炭素層 252 で覆うことで、金属層 251 の酸化還元を防止でき、測定感度及び再現性を向上できる。さらに、金属層 251 の上面と炭素層 252 との間にシリコンからなる上部接着層 254 を設けることで、金属層 251 と炭素層 252 との密着性を向上させるとともに、シリコンは金属に比べて電気抵抗率が高いことから測定中における金属層 251 の上面での水素の発生を抑制できる。これにより、基板 241 と金属層 251 との剥離を防止して、測定感度及び再現性を向上できる。

[0049] また、電極 242, 243, 244 は、基板 241 と金属層 251 との間に形成された下部接着層 253 を備えているので、測定中における基板 241 と金属層 251 との密着性の低下を防止でき、測定感度及び再現性を向上できる。

[0050] また、金属層 251、炭素層 252 及び接着層 253, 254 は、蒸着法

で形成されたものであって、金属層 251 及び接着層 253, 254 は平面視で同じ形状に形成されており、炭素層 252 は平面視で金属層 251 及び接着層 253, 254 の輪郭を囲うように形成されている。各層 251, 252, 253, 254 を蒸着法で形成することで、各層 251, 252, 253, 254 の形状及び膜厚を高精度に制御でき、電極 242, 243, 244 のそれぞれについて、全体の電気抵抗の安定性を向上できる。

[0051] また、下部接着層 253 はシリコンで形成されている。シリコンは、ガラスとの密着性及び金属との密着性がよいので、金属層 251 と基板 241 との密着性を強くできる。また、上部接着層 254 もシリコンで形成されている。シリコンは、金属との密着性及び炭素との密着性がよいので、金属層 251 と炭素層 252 との密着性を強くできる。

[0052] センサ部 22 は、作用電極 242 と参照電極 244 と対極 243 とを備えているので、3 電極方式の電気化学測定に適用できる。そして、作用電極 242、参照電極 244 及び対極 243 について、電気抵抗を低くでき、金属層 251 の酸化還元を防止でき、かつ、金属層 251 の剥離を防止できるので、測定感度及び再現性を向上できる。

[0053] なお、センサ部 22 は、作用電極 242 と参照電極 244 とを使用する 2 電極方式の電気化学測定で使用する 2 つの電極を備えたものであってもよい。そして、作用電極と参照電極の両方が金属層、炭素層及び接着層を有する電極で構成されているようにすれば、作用電極及び参照電極の両方について、電気抵抗を低くでき、金属層の酸化還元を防止でき、かつ、金属層の剥離を防止できるので、測定感度及び再現性を向上できる。

[0054] また、センサ部 22 の作用電極 242、対極 243 及び参照電極 244 は、上記構造に限定されず、例えば、銀、白金、金、アルミニウム、パラジウムなどの金属材料の単層構造、もしくは炭素などの導電性材料の単層構造、又はこれらの材料のうちの複数を積層した積層構造であってもよい。また、電極 242, 243, 244 において、下部接着層 253 は設けられていなくてもよい。

- [0055] 図1に示すように、ポテンショスタット3は、電極チップ24の作用電極242の電位が参照電極244に対して一定になるように制御するとともに、作用電極242と対極243との間に流れる電流を測定可能に構成されている。ポテンショスタット3は、概略構成として、演算制御部31、電圧印加部32及び電流検出部33を備えている。
- [0056] 演算制御部31は、電気化学測定で得られた測定値を用いて所定の演算処理を行なうとともに、操作部4を介して入力されたユーザからの指令に基づいて、電圧印加部32に必要な信号を送信したり、表示部5に測定結果等の情報を表示させたりする機能である。演算制御部31は、例えばマイクロコンピュータが所定のプログラムを実行することによって実現される。
- [0057] 電圧印加部32は、演算制御部31からの測定開始の信号を受信したときに、電極チップ24の作用電極242と対極243との間に所望の波形の電圧を印加して、作用電極242と参照電極244との間の電位が所望の電位になるように制御するように構成されている。
- [0058] 電流検出部33は、電極チップ24の作用電極242と対極243との間に流れる電流の大きさを検出するように構成されている。電流検出部33が検出した電流の大きさに関する信号は演算制御部31に取り込まれる。
- [0059] 演算制御部31は、電流検出部33から取り込んだ信号の基づき、例えば予め用意された検量線を用いて、試料溶液中の特定成分濃度等の計算を行ない、測定結果を表示部5に表示するように構成されている。
- [0060] 電気化学測定装置1において、操作部4は、電源のオン・オフや測定の開始、表示部5に表示される情報の変更といった操作をユーザが行なうための入力装置である。表示部5は、例えば液晶ディスプレイによって実現されるものである。なお、表示部5をタッチパネルで構成し、表示部5に操作部4の機能を兼ね備えさせてもよい。電源部6は、例えば乾電池や蓄電池などによって実現することができる。電源部6により、ポテンショスタット3や表示部5へ必要な電力が供給される。
- [0061] また、ポテンショスタット3には、USB（ユニバーサル・シリアル・バ

ス) 端子といった有線通信手段や無線通信手段によってパーソナルコンピュータ等の外部機器へ情報を出力することができるように、外部出力部7が接続されてもよい。その場合、演算制御部31は、外部出力部7を介して測定データ等を外部機器へ出力するように構成されている。

[0062] なお、操作部4、表示部5、電源部6及び外部出力部7は、例えば、ノートパソコンやタブレットなどのモバイルコンピュータで実現されるようにしてもよい。さらに、ポテンショスタット3として小型のもの（例えば小型ポテンショスタット「miniSTAT100」（バイオデバイステクノロジー製））を用いるようにすれば、電気化学測定装置1を持ち運び可能に構成できる。これにより、電気化学測定装置1を使用したオンサイト（現場）での試料液の測定が可能になる。

[0063] 電気化学測定装置1を使用した電気化学測定は、電気化学分析チップ2のセンサ部22に試料液が接触された状態で行われる。すなわち、電気化学分析チップ2の試料液供給口231に試料液が接触され、試料液流路232及び電極チップ配置部216に試料液が導入された状態で、測定が行われる。

[0064] 次に、電極チップ24の作製例について説明する。基板241としての厚さ2500nm（2.5 $\mu$ m）程度のガラス基板の上に、スパッタリング法により、下部接着層形成領域に対応する開口パターンを有するメタルマスクを用いて厚さ20nm程度のシリコン層を下部接着層253として形成した。なお、シリコンからなる下部接着層253の膜厚は特に限定されない。

[0065] そのメタルマスクの下部接着層形成領域に対応する開口パターンと同一開口パターンを有するメタルマスクを使用して、下部接着層253上に、スパッタリング法により厚さ150nm程度の銀層を金属層251として形成した。

[0066] その後、下部接着層形成領域に対応する開口パターンと同一開口パターンを有するメタルマスクを使用して、金属層251上に、スパッタリング法により厚さ20nm程度のシリコン層を上部接着層254として形成した。なお、シリコンからなる上部接着層254の膜厚は特に限定されない。

- [0067] ここでは、基板 241 をスパッタリング装置のチャンバー内に搬入した後、同一メタルマスクを用いて、基板 241 上に下部接着層 253、金属層 251、上部接着層 254 を、チャンバーから搬出せずに成膜した。これにより、下部接着層 253、金属層 251 及び上部接着層 254 の成膜に要する時間を短縮できるとともに、各層の間への異物の付着を防止できる。また、金属層 251 及び接着層 253、254 は平面視で同じ形状に形成される。
- [0068] 下部接着層 253、金属層 251 及び上部接着層 254 の線幅（長手方向に直交する幅方向の寸法）は、0.6 mm 程度である。
- [0069] スパッタリング法により、下部接着層形成領域を囲う開口パターンを有するメタルマスクを使用して、下部接着層 253、金属層 251 及び上部接着層 254 を覆うように、厚さ 1000 nm 程度の炭素層 252 を形成した。炭素層 252 の線幅は、1 mm 程度である。これにより、下部接着層 253、金属層 251、上部接着層 254 及び炭素層 252 をそれぞれ有する作用電極 242、対極 243 及び参照電極 244 を形成した。
- [0070] このように、蒸着法（ここではスパッタリング法）により、下部接着層 253、金属層 251、上部接着層 254 及び炭素層 252 を、開口パターンを有するメタルマスクを使用して形成することで、各層の成膜後にエッチング法やリフトオフ法によるパターニングが不要であり、製造コストを低減できる。
- [0071] 参照電極 244 の一端側の炭素層 252 上面に、成膜法により、厚さ 1000 nm 程度の銀層を成膜し、塩化处理して銀塩化銀層 255 を形成した。このようにして、電極チップ 24 を作製した。
- [0072] 電極チップ 24 の各電極 242、243、244 において、金属層 251 の側面は炭素層 252 と接触しており、電気化学測定時には、炭素層 252 に浸透した水に起因して金属層 251 の側面での水素の発生が考えられるが、金属層 251 の膜厚は 150 nm と非常に薄いことから、金属層 251 の側面で仮に水素が発生しても、その水素の量は極少量であり、測定に与える影響は小さいと考えられる。

[0073] 金属層251の膜厚は、特に限定されないが、50nm以上、1000nm以下であることが好ましい。この範囲内にあると、金属層251の側面で発生する水素の量を少量に抑制しながら、電極242, 243, 244の全体の抵抗値を低減できるからである。なお、金属層251の膜厚が50nmよりも薄いと、電極242, 243, 244が高抵抗となって測定感度が低下する。また、金属層251の膜厚が1000nmよりも厚いと、金属層251の側面で発生する水素が測定に与える影響が大きくなる。特に、金属層251を蒸着法（例えばスパッタリング法）で成膜する場合には、金属層251の膜厚が1000nmよりも厚くなると、金属層251の成膜に要する時間が長くなり、生産効率が低下する。

[0074] なお、1枚の基板241に複数の電極チップ24の領域を設けて、複数の電極チップ24を同時に形成した後、各電極チップ24を個片化することで、製造コストを低減できる。

[0075] 次に、電極チップ24を使用した測定例について説明する。100ppmの鉛標準溶液（和光純薬工業株式会社）を蒸留水で1000ppb（=1ppm）に希釈したものをサンプルとして使用した。電極チップ24の比較例として、電極チップ24に対して接着層253, 254を形成せずに、基板241上に金属層251と炭素層252を形成したものを作製し、比較チップとして使用した。

[0076] ポテンショスタット3として小型ポテンショスタット「miniSTAT100」（バイオデバイステクノロジー製）を使用した。微分パルスボルタンメトリー（DPV）により電気化学測定を行った。DPVによる測定は、作用電極の電位を-1500mVから300mVに変化させていき、電位増加0.004V、パルス振幅0.05V、パルス期間0.2秒、掃引速度0.02V/sで行った。電極チップ24と比較チップの上に上記サンプルをそれぞれ20μL程度滴下して測定を行った。得られた電流電位曲線を図7に示す。図7において、縦軸は電流、横軸は電位を示す。

[0077] 図7からわかるように、実施形態の電極チップ24を使用した測定（実線

A参照)では、良好なPbピークが得られた。これに対して、比較チップを使用した測定(破線B参照)では、実施形態に比べてPbピークが小さく、Agピークが大きくなることが確認された。

[0078] 図8は、測定後の電極チップ24及び比較チップの作用電極242を基板241側から撮像した顕微鏡写真であり、(A)は実施形態(電極チップ24)を示し、(B)は比較例(比較チップ)を示す。

[0079] 図8からわかるように、(B)比較チップでは金属層251の剥離が観察されたが、(A)実施形態の電極チップでは金属層及び下部接着層253の剥離は観察されなかった。

[0080] このように、基板241と金属層251との間に下部接着層253を設けることで、基板241と金属層251との剥離を防止して、測定感度及び再現性を向上できることが確認された。

[0081] 電極チップ24において、図9に示すように、シリコンからなる上部接着層254が金属層251の側面も覆うように形成されていてもよい。このような上部接着層254は、蒸着法(例えばスパッタリング法)によって形成できる。これにより、金属層251と炭素層252とが接触する領域を無くし、炭素層252に水が浸透しても、測定時における金属層251表面での水素の発生を防止できるとともに、金属層251と炭素層252の密着性を向上できる。これにより、炭素層252の剥離をより確実に防止できる。

[0082] 次に、図10を参照して、電気化学分析チップの他の実施形態を説明する。図10は、電気化学分析チップの他の実施形態を示す平面図である。なお、図10では、カバー基板213の図示は省略している。

[0083] この実施形態の電気化学分析チップ2Aでは、流路部23は、複数のセンサ部22ごとに試料液供給口231と試料液流路232とを備えている。すなわち、流路基板212Aの一表面に形成された3本の溝215は、互いに分離して設けられている。そして、3本の溝215の一端部で構成される3つの試料液供給口231は、基材21Aの外表面(流路基板212Aの第2側面212b)に互いに近接配置されている。

- [0084] 電気化学分析チップ2 Aによれば、センサ部2 2ごとに試料液供給口2 3 1と試料液流路2 3 2とを設けることで、各センサ部2 2に試料液を確実に導入できる。また、センサ部2 2ごとに設けられた試料液供給口2 3 1が基材2 1 Aの外面に互いに近接配置されていることで、それらの試料液供給口2 3 1に1回のサンプリング操作で試料液を確実に接触させることができ、サンプリング処理の確実性を向上できる。
- [0085] 次に、図1 1及び図1 2を参照して、電気化学分析チップのさらに他の実施形態を説明する。図1 1は、電気化学分析チップのさらに他の実施形態を示す平面図である。図1 2は、同電気化学分析チップの分離斜視図である。なお、図1 1では、カバー基板2 1 3 Bの図示は省略している。
- [0086] この実施形態の電気化学分析チップ2 Bでは、基材2 1 Bは、センサ部2 2が形成されたベース基板2 1 1 Bと、流路部2 3を形成する流路基板2 1 2 Bと、流路基板2 1 2 Bを覆うカバー基板2 1 3 Bとが積層されて構成されている。
- [0087] 各センサ部2 2は、上記実施形態の電気化学分析チップ2に設けられた電極チップ2 4の電極2 4 2, 2 4 3, 2 4 4と同じ構成の作用電極2 4 2、対極2 4 3及び参照電極2 4 4の一端部で形成されている。電極2 4 2, 2 4 3, 2 4 4の他端部側は、ベース基板2 1 1 Bの一側部に突設されたコネクタ接続部2 1 7の上に配置されている。
- [0088] 流路基板2 1 2 Bには、上記実施形態の電気化学分析チップ2に設けられた切欠き部2 1 4（図2及び3などを参照）に替えて、貫通孔からなる試料液収容部2 1 8が形成されている。試料液収容部2 1 8は、ベース基板2 1 1 Bと流路基板2 1 2 Bとを重ねた状態で、センサ部2 2を囲う位置に形成されている。
- [0089] また、流路基板2 1 2 Bには、上記実施形態の電気化学分析チップ2と同様に、試料液供給口2 3 1及び試料液流路2 3 2を形成するための流路部2 3が形成されている。試料液流路2 3 2の試料液供給口2 3 1とは反対側の端部は、試料液収容部2 1 8につながっている。

- [0090] 流路基板 2 1 2 B に接合されるカバー基板 2 1 3 B には、平面視で試料液収容部 2 1 8 と重なる位置に、空気孔 2 1 9 が形成されている。
- [0091] サンプリング操作によって、電気化学分析チップ 2 B の試料液供給口 2 3 1 に試料液が供給されると、試料液は、毛細管現象によって、試料液流路 2 3 2 内を 3 つの試料液収容部 2 1 8 のそれぞれに向かって流れ、各試料液収容部 2 1 8 に導入され、各センサ部 2 2 に接触する。このように、電気化学分析チップ 2 B は、1 回のサンプリング操作で複数のセンサ部 2 2 に同一の試料液を接触させることができる。
- [0092] このような態様によれば、複数のセンサ部 2 2 をベース基板 2 1 1 B に一体化することで、電気化学分析チップ 2 B の小型化が可能になる。なお、センサ部 2 2 をベース基板 2 1 1 B に一体化した構成は、センサ部 2 2 ごとに試料液供給口 2 3 1 及び試料液流路 2 3 2 を設ける構成（図 1 0 参照）にも適用可能である。
- [0093] 本発明は、前述の実施形態に限らず、様々な態様に具体化できる。例えば、電気化学分析チップは、電極として作用電極 2 4 2 及び参照電極 2 4 4 を備え、対極 2 4 3 を備えていない構成であって、二電極方式の電気化学測定に適用可能な構成であってもよい。
- [0094] また、試料液供給口が配置される位置は、電気化学分析チップを構成する基材の側面に限定されず、試料液供給口は、基材の一平面（例えば、ベース基板 2 1 1 の流路基板 2 1 2 とは反対側の面、又はカバー基板 2 1 3 の流路基板 2 1 2 とは反対側の面）に配置されていてもよい。
- [0095] また、本発明の電気化学分析チップは、微分パルスボルタンメトリー（D P V）に限らず、リニアスイープボルタンメトリー（L S V）、クロノアンペアメトリー（C A）、サイクリックボルタンメトリー（C V）、短波形ボルタンメトリー（S W V）などの方法にも適用可能である。

### 符号の説明

- [0096] 2、2 A、2 B 電気化学分析チップ  
2 1、2 1 A、2 1 B 基材

- 2 2 センサ部
- 2 3 流路部
- 2 4 電極チップ
  - 2 1 1, 2 1 1 A, 2 1 1 B ベース基板
  - 2 1 2, 2 1 2 A, 2 1 2 B 流路基板
    - 2 1 2 b 第2側面（基材の外面の一例）
  - 2 1 3, 2 1 3 B カバー基板
  - 2 1 6 電極チップ配置部
- 2 3 1 試料液供給口
- 2 3 2 試料液流路
- 2 4 2 作用電極（電極の一例）
- 2 4 3 対極（電極の一例）
- 2 4 4 参照電極（電極の一例）

## 請求の範囲

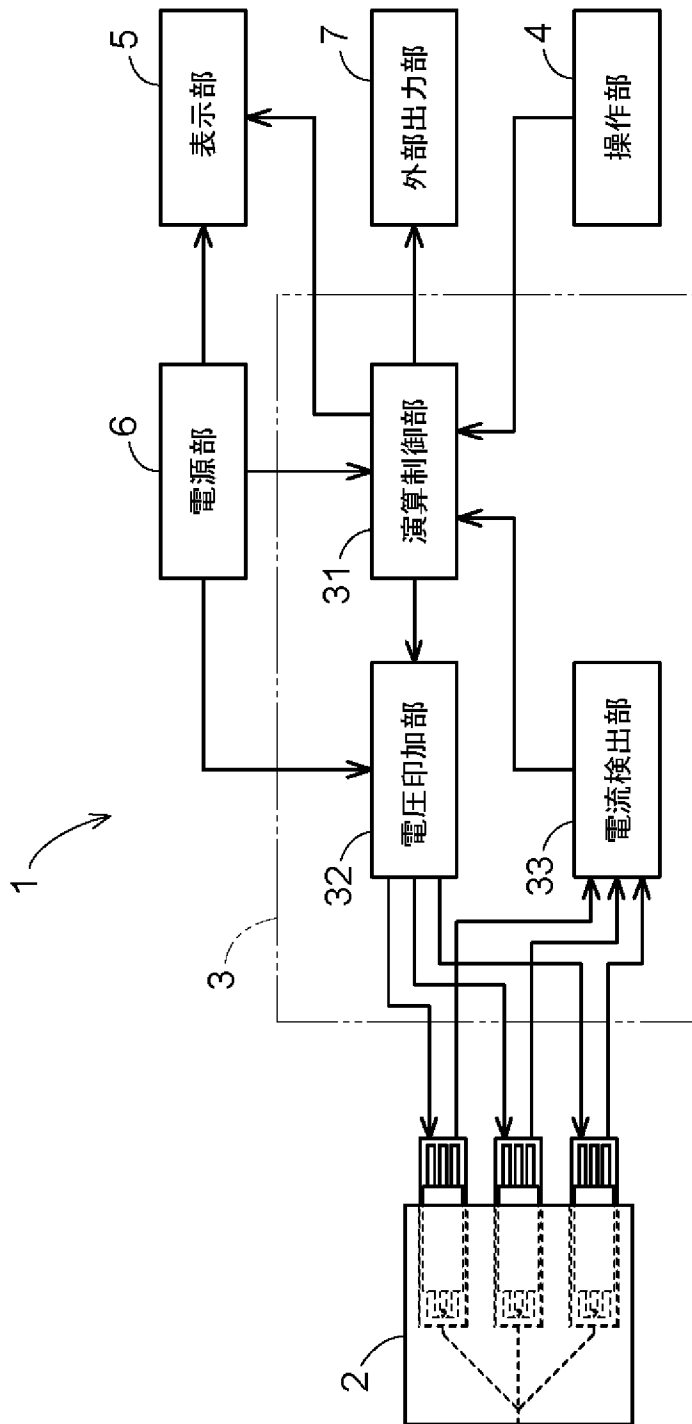
- [請求項1] 複数の電極を有するとともに絶縁性の基材に設けられたセンサ部と、前記基材に設けられて試料液を前記センサ部に導く流路部とを備えた電気化学分析チップであって、  
前記基材に複数の前記センサ部が設けられており、  
前記流路部は、前記基材の外面に開口した試料液供給口と、同一の試料液を前記試料液供給口から複数の前記センサ部に導く試料液流路とを備えている、電気化学分析チップ。
- [請求項2] 前記流路部は、1つの前記試料液供給口に繋がる複数の前記試料液流路を備えている、請求項1に記載の電気化学分析チップ。
- [請求項3] 前記流路部は、複数の前記センサ部ごとに前記試料液供給口と前記試料液流路とを備えており、  
複数の前記試料液供給口は、前記基材の外面に互いに近接配置されている、請求項1に記載の電気化学分析チップ。
- [請求項4] 前記センサ部は、前記基材に装着可能な電極チップに設けられており、  
前記基材は、前記基材の外面に開口して前記電極チップが挿入される電極チップ配置部を備えており、  
前記電極チップ配置部に前記試料液流路が繋がっていると同時に、前記電極チップ配置部の内壁と前記電極チップとの間に、試料液が毛細管現象によって前記試料液流路から前記電極チップ配置部の開口に向けて浸透する隙間が設けられている、請求項1～3のいずれか一項に記載の電気化学分析チップ。
- [請求項5] 前記基材は、前記センサ部が形成されたベース基板と、前記流路部を形成する流路基板と、前記流路基板を覆うカバー基板とが積層されて構成されている、請求項1～3のいずれか一項に記載の電気化学分析チップ。
- [請求項6] 前記センサ部は、前記電極として、作用電極と参照電極とを備えて

おり、又は作用電極と参照電極と対極を備えており、

前記電極は、絶縁性の基板の上に形成された金属層と、前記基板の上に前記金属層を覆って形成された炭素層と、前記金属層の上面と前記炭素層との間に形成された上部接着層と、を備え、

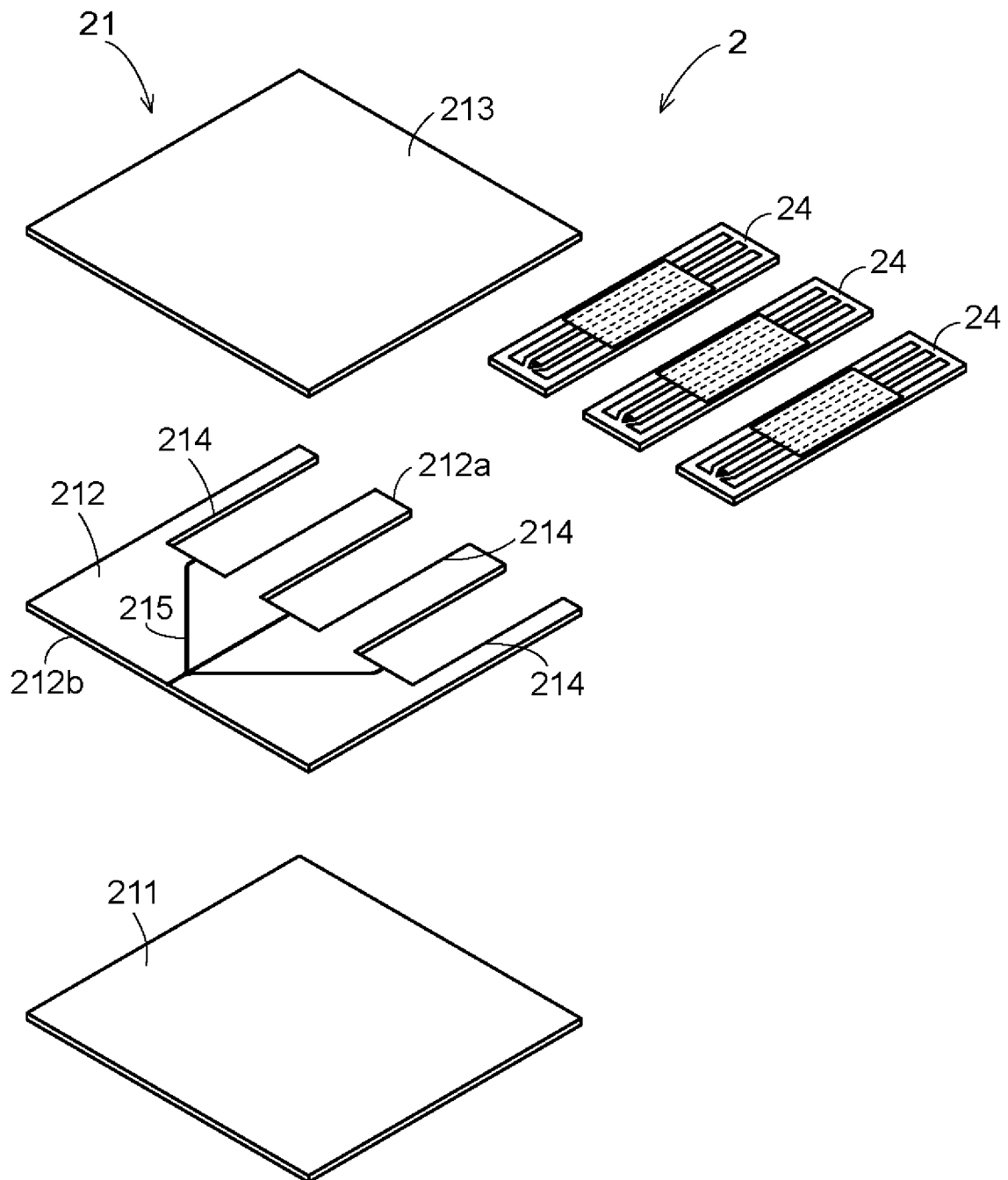
前記上部接着層はシリコンで形成されている、請求項 1～5 のいずれか一項に記載の電気化学分析チップ。

[図1]

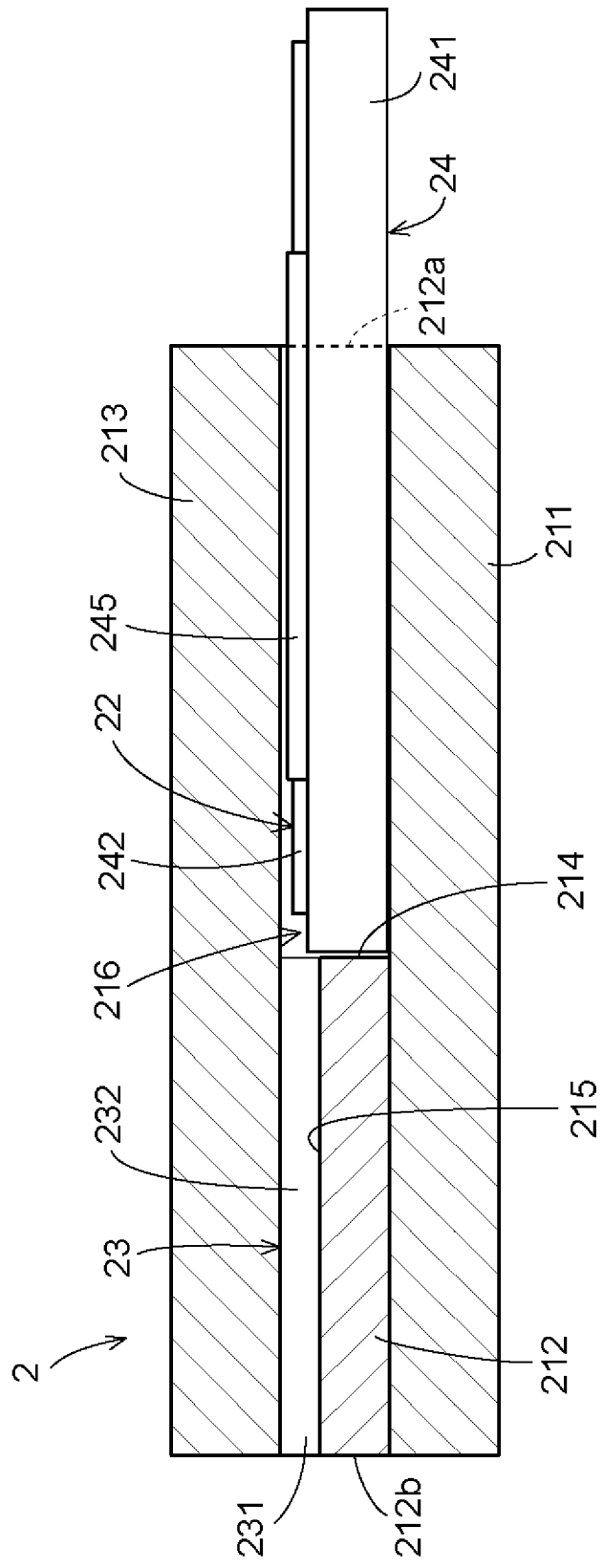




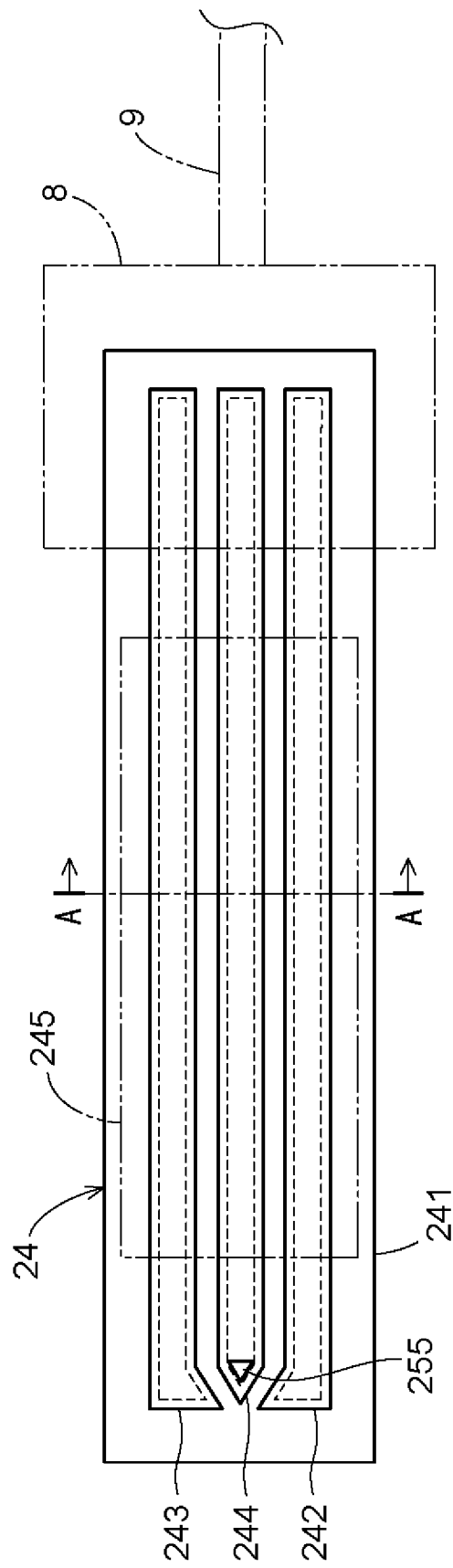
[図3]



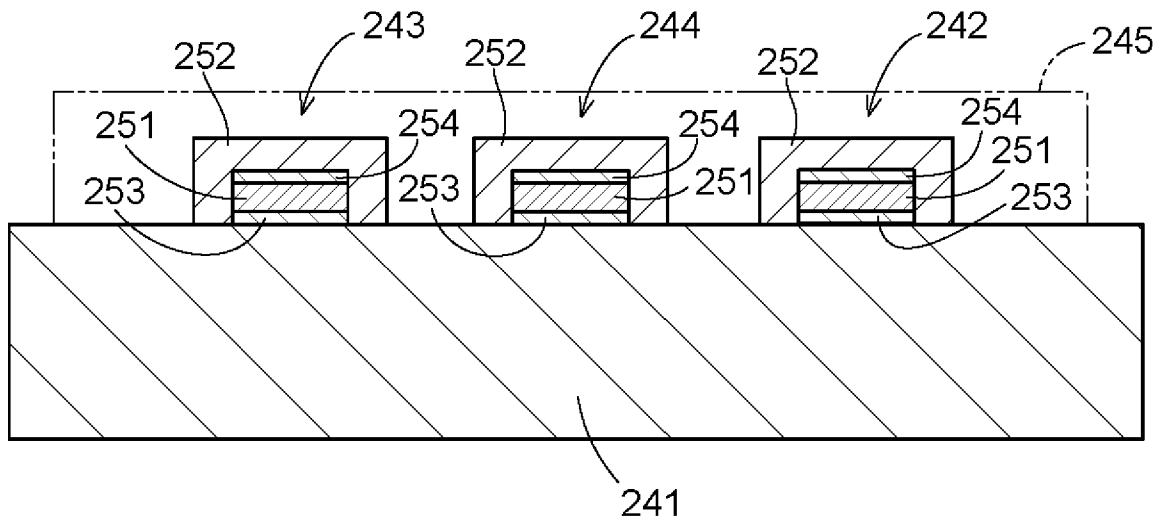
[図4]



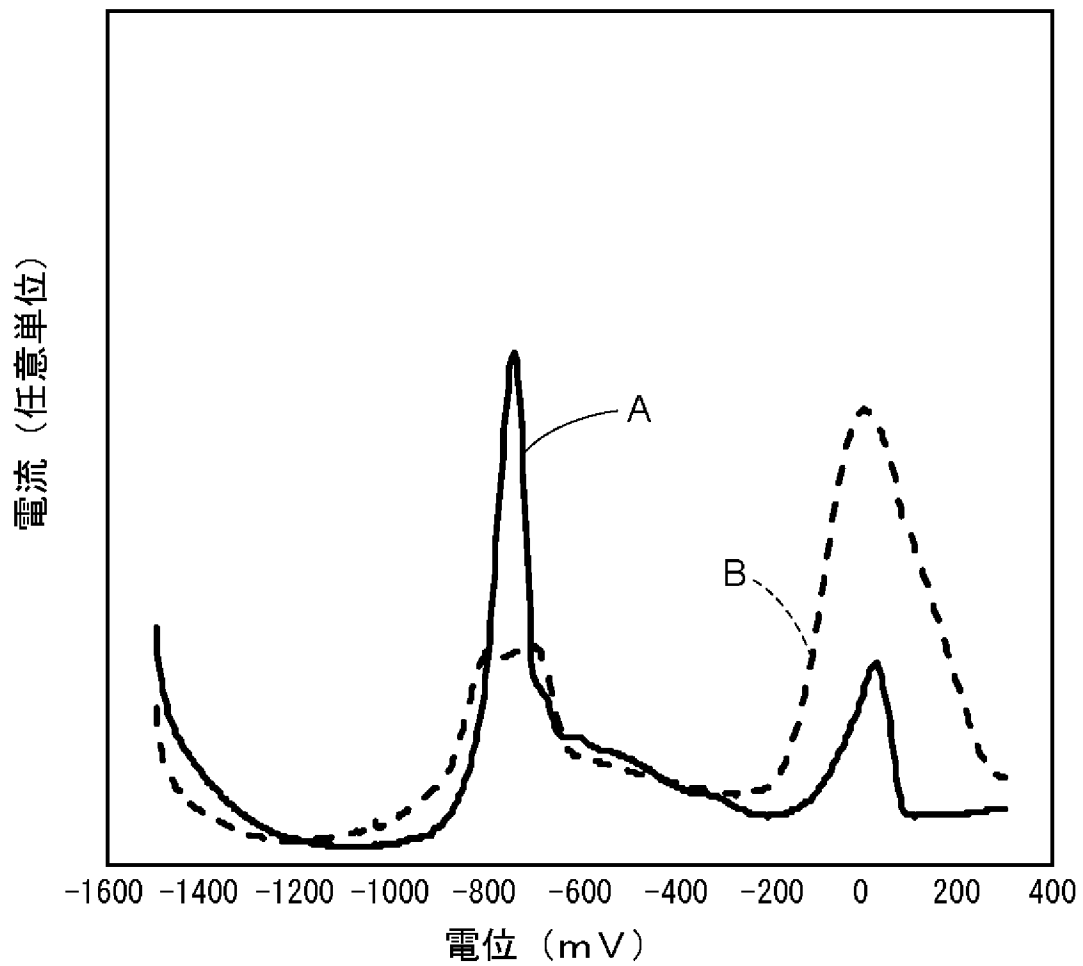
[図5]



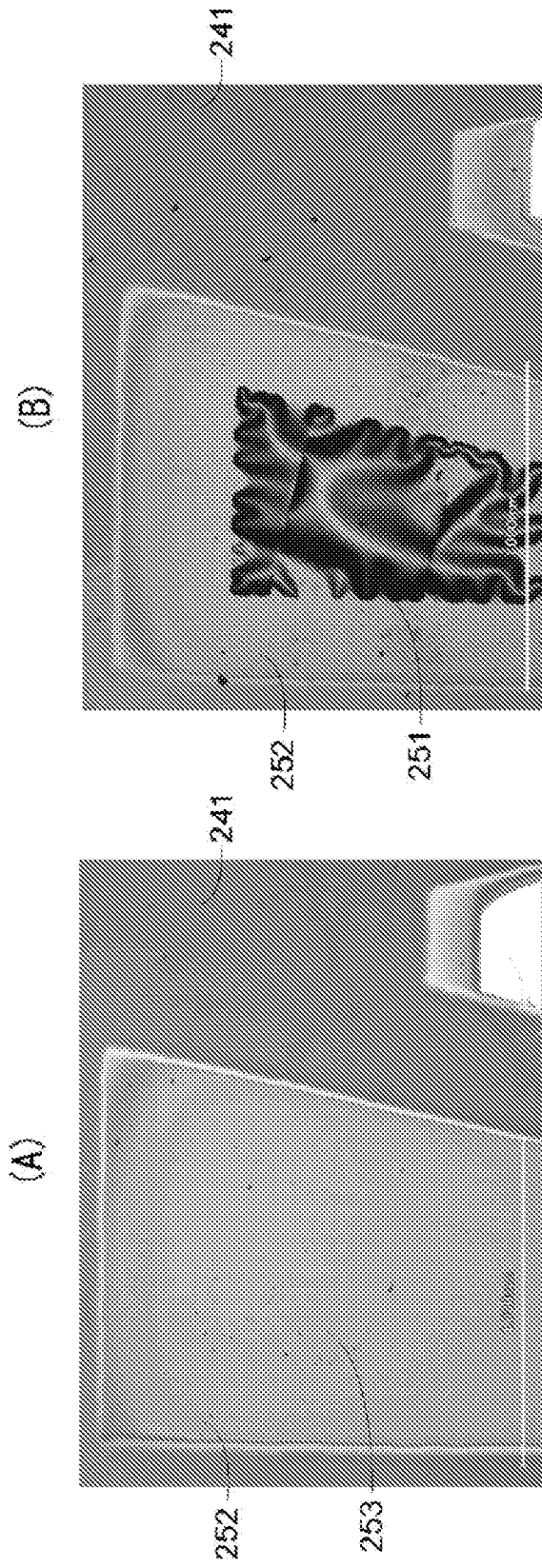
[図6]



[図7]

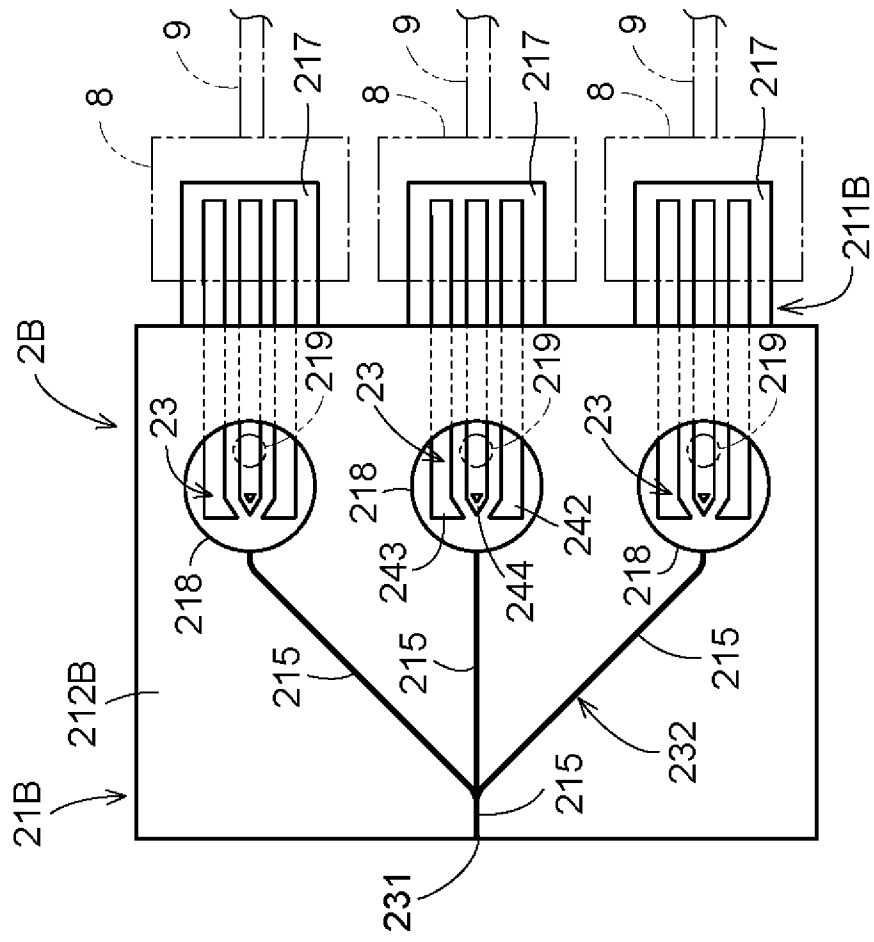


[図8]

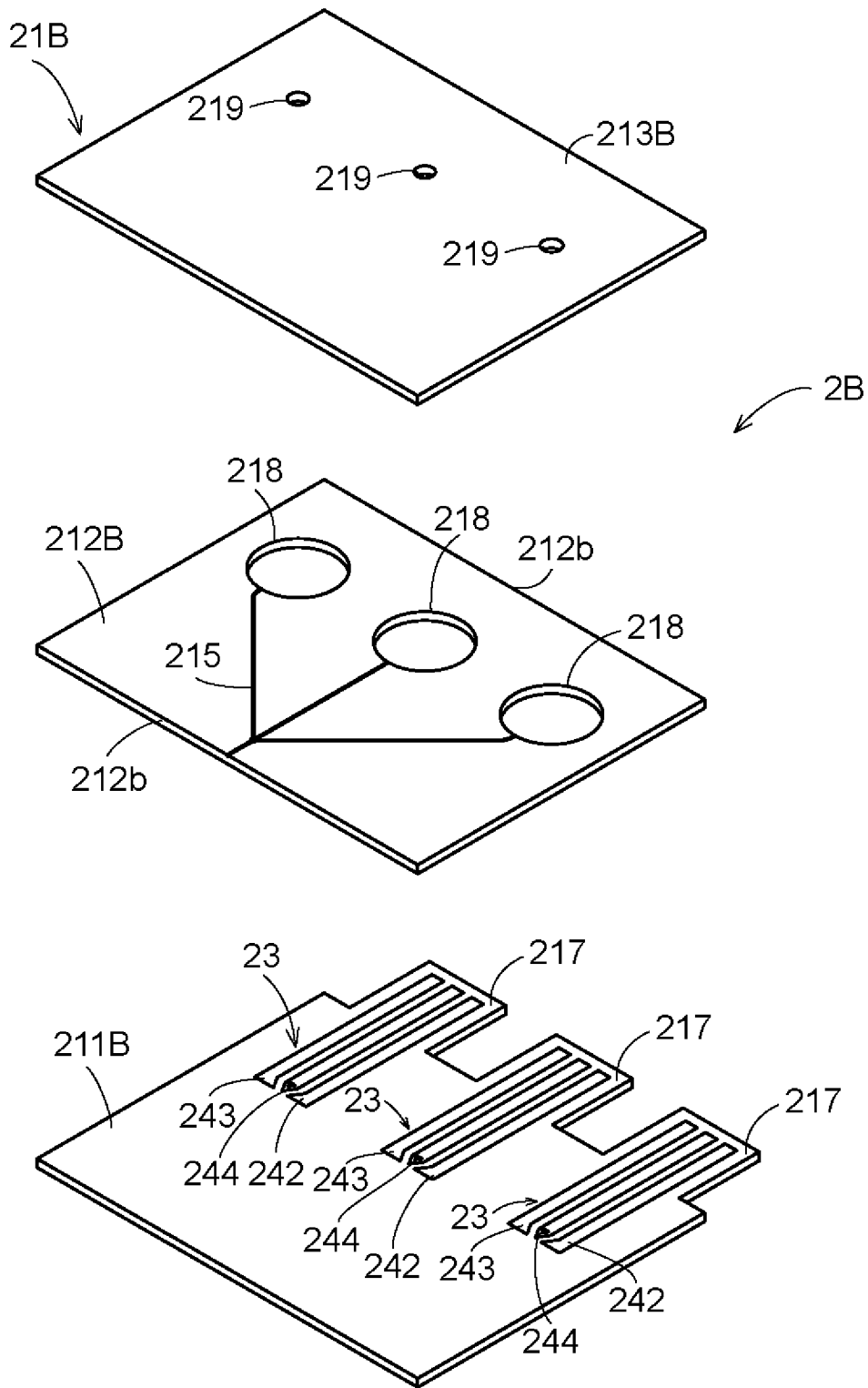




[図11]



[図12]



**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2020/014117

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 G01N 27/28(2006.01) i; G01N 27/30(2006.01) i  
 FI: G01N27/28 M; G01N27/30 B  
 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**  
 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
 G01N27/00-27/49

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2020
Registered utility model specifications of Japan	1996-2020
Published registered utility model applications of Japan	1994-2020

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
 JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	JP 2004-117342 A (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 15 April 2004 (2004-04-15) paragraphs [0029]-[0032], [0061]-[0065], fig. 1-2, 14	1-3, 5 4, 6
X A	JP 1-291153 A (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 22 November 1989 (1989-11-22) page 3, lower right column, line 15 to page 4, upper right column, line 17, fig. 8	1-2, 5 3-4, 6
A	US 2019/0302097 A1 (SHENZHEN XLAOFU MEDICAL TECHNOLOGY CO.) 03 October 2019 (2019-10-03) entire text, all drawings	1-5
A	WO 94/02631 A1 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) 03 February 1994 (1994-02-03) entire text, all drawings	1-5
A	JP 2019-105637 A (NITTO DENKO CORP.) 27 June 2019 (2019-06-27) claims, paragraphs [0021]-[0037], fig. 1	6
A	WO 2010/004690 A1 (NEC CORP.) 14 January 2010 (2010-01-14) paragraphs [0019]-[0026], fig. 1	6

Further documents are listed in the continuation of Box C.       See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 11 June 2020 (11.06.2020)	Date of mailing of the international search report 23 June 2020 (23.06.2020)
--	---

Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	Authorized officer  Telephone No.
--	---

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
Information on patent family members

International application no.

PCT/JP2020/014117

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2004-117342 A	15 Apr. 2004	US 2004/0040866 A1 paragraphs [0051]- [0054], [0079]- [0086], fig. 1-2, 14 EP 1396717 A1 CN 1490619 A CN 101165479 A	
JP 1-291153 A	22 Nov. 1989	US 5120420 A column 8, lines 3-52, fig. 12 WO 1989/009397 A1 EP 359831 A1	
US 2019/0302097 A1	03 Oct. 2019	WO 2017/210976 A1 entire text, all drawings CN 105890927 A	
WO 94/02631 A1	03 Feb. 1994	US 5876959 A entire text, all drawings US 6143555 A EP 609458 A1	
JP 2019-105637 A	27 Jun. 2019	WO 2019/117112 A1	
WO 2010/004690 A1	14 Jan. 2010	(Family: none)	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） G01N 27/28(2006.01)i; G01N 27/30(2006.01)i FI: G01N27/28 M; G01N27/30 B		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） G01N27/00-27/49 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2020年 日本国実用新案登録公報 1996-2020年 日本国登録実用新案公報 1994-2020年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語） JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamII)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X A	JP 2004-117342 A (松下電器産業株式会社) 15.04.2004 (2004-04-15) [0029]-[0032]、[0061]-[0065]、第1-2、14図	1-3,5 4,6
X A	JP 1-291153 A (松下電器産業株式会社) 22.11.1989 (1989-11-22) 第3頁右下欄第15行-第4頁右上欄第17行、第8図	1-2,5 3-4,6
A	US 2019/0302097 A1 (SHENZHEN XLAOFU MEDICAL TECHNOLOGY CO.) 03.10.2019 (2019-10-03) 全文、全図	1-5
A	WO 94/02631 A1 (ダイキン工業株式会社) 03.02.1994 (1994-02-03) 全文、全図	1-5
A	JP 2019-105637 A (日東電工株式会社) 27.06.2019 (2019-06-27) 特許請求の範囲、[0021]-[0037]、第1図	6
A	WO 2010/004690 A1 (日本電気株式会社) 14.01.2010 (2010-01-14) [0019]-[0026]、第1図	6
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 11.06.2020	国際調査報告の発送日 23.06.2020	
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員（特許庁審査官） 黒田 浩一 2J 9218 電話番号 03-3581-1101 内線 3252	

国際調査報告  
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号  
 PCT/JP2020/014117

引用文献	公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP 2004-117342 A	15.04.2004	US 2004/0040866 A1 [0051]-[0054]、 [0079]-[0086]、 第1-2図、14図 EP 1396717 A1 CN 1490619 A CN 101165479 A	
JP 1-291153 A	22.11.1989	US 5120420 A 第8欄第3行-第52行、 第12図 WO 1989/009397 A1 EP 359831 A1	
US 2019/0302097 A1	03.10.2019	WO 2017/210976 A1 全文、全図 CN 105890927 A	
WO 94/02631 A1	03.02.1994	US 5876959 A 全文、全図 US 6143555 A EP 609458 A1	
JP 2019-105637 A	27.06.2019	WO 2019/117112 A1	
WO 2010/004690 A1	14.01.2010	(ファミリーなし)	